



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

con il patrocinio di



SCUOLA FORENSE OAB



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

SEMINARIO

La metrologia forense

Saluti

*Professor Saverio Regasto – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Professor Emilio Sardini – Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Avvocato Fausto Pelizzari – Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Brescia*

Relatori

Alessandro Ferrero

Professore ordinario presso il Politecnico di Milano

Veronica Scotti

*Avvocato nel foro di Milano
e docente a contratto presso il Politecnico di Milano*

*Discussant: Giuseppe Finocchiaro
Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di
Brescia*

Giovedì 5 ottobre 2017 - ore 15.00-18.30

AULA VII

**PALAZZO DEI MERCANTI - CORSO MAMELI, 27
BRESCIA**

**La partecipazione all'evento riconosce agli avvocati n. 3 crediti
formativi nella materia "evento multidisciplinare"**

L'espressione «metrologia forense» inizia ad essere utilizzata in tempi relativamente recenti, ma si occupa di problemi presenti nella pratica forense da lungo tempo. Nasce, come evidente dalle due parole da cui è composta, dalle applicazioni della metrologia alle scienze forensi e si colloca a cavallo tra le discipline giuridiche e quelle ingegneristiche delle misure.

E' ben noto che un numero sempre maggiore di casi discussi in sede giudiziale è deciso facendo riferimento a conoscenze scientifiche utilizzate allo scopo di ricostruire la verità fattuale sulla base di rilievi scientifici, test e misure, i cui risultati assumono un peso determinante nelle decisioni adottate.

La valenza sempre più rilevante che le prove scientifiche stanno acquisendo trova una spiegazione nella maggiore fiducia generalmente assegnata ai rilievi scientifici, spesso visti con maggiore favore, in conseguenza della loro apparente maggiore oggettività rispetto ad altri elementi di prova (quali ad esempio testimonianze), ritenuti, invece, per loro natura più fallaci.

Tuttavia la scienza non è in grado di garantire assoluta certezza.

Questo vale specialmente nelle ipotesi in cui le decisioni si basano, come nella maggior parte dei casi, su risultati di misure (profili di DNA, prove tossicologiche, test alcolimetrici, misure di velocità, localizzazione per mezzo di triangolazioni su telefoni cellulari...) per loro natura affetti da incertezza generalmente non trascurabile.

Purtroppo, nella attuale pratica processuale, l'incertezza che caratterizza i dati di misura viene spesso trascurata, assegnando ai valori misurati una certezza assoluta che non compete loro. La conseguenza, come verrà mostrato nel corso del seminario, è di nascondere al giudicante un importante elemento di prova, atto a quantificare il dubbio sulla correttezza di una decisione assunta sulla base di quei risultati.

Tali aspetti, di carattere prettamente tecnico, ma con risvolti giuridici significativi, sono discussi da anni, specialmente nelle nazioni di *Common Law*: recenti esempi, in specie negli USA, sono rappresentati da due importanti documenti: il rapporto del *National Research Council* del 2009, in cui si esprimevano forti dubbi sulla correttezza delle modalità di impiego dei metodi delle scienze forensi in sede giudiziaria ed un rapporto del *President's Council of Advisors on Science and Technology* (PCAST) del 2016, in cui si discute come assegnare validità scientifica ai metodi delle scienze forensi.

Le indicazioni che emergono da questi due documenti portano a ritenere che i metodi propri della metrologia possano costituire uno strumento estremamente utile a quantificare la «validità» di questi metodi e, conseguentemente, la «affidabilità» dei risultati quali elementi di prova.

Il seminario si propone di analizzare gli aspetti salienti di questa disciplina facendo riferimento al contesto internazionale e nazionale.

I relatori:

Alessandro Ferrero è professore Ordinario di Misure Elettriche ed Eletttroniche presso il Politecnico di Milano. Si occupa di misure sui sistemi elettrici di potenza, di elaborazione numerica di segnali, di metodi di valutazione ed espressione dell'incertezza di misura e di metrologia forense. Ha presieduto il GMEE nel triennio 2004-2007 e la *Instrumentation and Measurement Society* dell'IEEE nel biennio 2008-2009. E' stato *Editor in Chief* delle *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* dal 2012 al 2016. E' *Fellow Member* dell'IEEE ed *Associate Member* dell'*American Academy on Forensic Sciences* (AAFS). Nel 2006 ha ricevuto l'*IEEE Joseph F. Keithley Technical field award on Instrumentation and Measurement*. Dal 2011 è membro straniero per la classe delle Scienze Tecniche della Reale Accademia Fiamminga delle Scienze e delle Arti del Belgio. Nel 2014 è stato insignito del titolo di *Doctor Honoris Causa* dal Politecnico di Bucarest.

Veronica Scotti è avvocato iscritto al Foro di Milano e pratica la libera professione dal 2000, occupandosi di contenzioso giudiziale e stragiudiziale in ambiti che coinvolgono aspetti tecnici, quali urbanistica, ambiente e prodotti CE. È docente a contratto dal 2007 presso il Politecnico di Milano per materie giuridiche e collabora con associazioni internazionali attive nel campo delle misure (quali IEEE). In diverse occasioni è stata invitata a tenere seminari e *tutorial* relativi alla metrologia forense e legale. È collaboratrice permanente della rivista *Tutto Misure* e dell'*IEEE Instrumentation and Measurement Magazine*. E' *Associate Member* dell'*American Academy on Forensic Sciences* (AAFS). E' stata tra i primi, in Italia, ad occuparsi di metrologia forense e delle applicazioni della metrologia in ambito giuridico.